Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio de fuerza atómica de barrido para investigación B2-01-35-162-4512

Código: B2-01-35-162-4512

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

▶Personalización a la medida para distintas necesidades

●Admite múltiples modos de trabajo y ampliaciones con módulos funcionales, y cubre la gran mayoría de las aplicaciones básicas de investigación científica.

●Diseño estructural abierto, que permite elegir más funciones personalizadas.

▶Una combinación perfecta de excelente experiencia y alta precisión

●Escáner de cerámica piezoeléctrica de lazo cerrado con tres ejes XYZ independientes, que logra simultáneamente posicionamiento de alta precisión y mediciones de barrido de alta resolución.

●La medición de barrido con cerámica piezoeléctrica de lazo cerrado no requiere corrección no lineal, y la caracterización nanométrica y la exactitud de medición son mejores que 99,5%.

B2-01-35-162-4512 Microscopio de fuerza atómica de barrido para investigación	
Rango de barrido	XY lazo cerrado 100 * 100um, Z lazo cerrado 10um
Resolución de barrido	XY lazo cerrado 0,2nm, Z lazo cerrado 0,04nm
Velocidad de barrido	0,1Hz~100Hz
Nivel de ruido del sistema	RMS≤ 30 pm
Puntos de muestreo de imagen	Hasta 4096 * 4096
Método de amortiguación de vibraciones	Amortiguador de flotación neumática o amortiguador activo opcional
Función de nanograbado	Grabado mecánico, grabado eléctrico
Modo de medición magnética	Modo de fuerza magnética (MFM), campo magnético externo ajustable
Función de control ambiental	Modo de imagen en líquido, modo de control de atmósfera sellada (gas especial), modo de control de temperatura integrado (-20C~200), modo de medición electroquímica
Modo de imagen estándar	Modo de contacto, modo de golpeteo (Tap), imagen de fase, modo de fuerza lateral (LFM)
Modo de medición mecánica	Curva de fuerza F-Z, curva RMS-Z, imagen avanzada de espectro de fuerza, medición de mapeo mecánico
Modo de medición eléctrica	EFM, C-AFM, KPFM, PFM, SSRM, SCM
Funciones ópticas auxiliares	Puede usarse en combinación con microscopio estereoscópico, microscopio metalográfico vertical y microscopio biológico invertido

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

◆ El cabezal de detección láser y la platina de barrido de la muestra están integrados, la estructura es muy estable y tiene alta resistencia a las interferencias

◆ Dispositivo de posicionamiento de precisión de la sonda, el ajuste de alineación del punto láser es muy fácil

◆ La muestra, accionada por un solo eje, se aproxima automáticamente a la sonda en forma vertical, de modo que la punta queda perpendicular al barrido de la muestra

◆ El método inteligente de aproximación de la aguja, con detección automática mediante cerámica piezoeléctrica presurizada controlada por motor, protege la sonda y la muestra

◆ Se pueden elegir libremente escáneres de cerámica piezoeléctrica de alta precisión y amplio rango

◆ Posicionamiento óptico automático con objetivo de alto aumento, sin necesidad de enfocar, con observación y posicionamiento en tiempo real del área de barrido de la muestra con la sonda

◆ Método antivibratorio de suspensión por resortes, simple y práctico, con buen efecto antivibratorio

◆ Caja insonorizada con blindaje metálico, con sensor de temperatura y humedad de alta precisión integrado, para monitoreo en tiempo real del entorno de trabajo

◆ Editor de usuario integrado para la corrección no lineal del escáner; caracterización nanométrica y exactitud de medición mejor que 98%

□	Resolución	Condición de trabajo	Temperatura de trabajo	Daño a la muestra	Profundidad de inspección
SPM	Nivel atómico 0,1nm	Normal, líquido, vacío	Temperatura ambiente o baja	Ninguno	1~2 niveles atómicos
TEM	Punto 0,3~0,5nm Red cristalina 0,1~0,2nm	Alto vacío	Temperatura ambiente	Pequeño	Generalmente<100nm
SEM	6-10nm	Alto vacío	Temperatura ambiente	Pequeño	10mm @10x 1um @10000x
FIM	Nivel atómico 0,1nm	Ultra alto vacío	30~80K	Daño	Espesor atómico

Microscopio	Microscopio óptico	Microscopio electrónico	Microscopio de sonda de barrido
Resolución máxima (um)	0,18	0,00011	0,00008
Observación	Inmersión en aceite 1500x	Imágenes de átomos de carbono de diamante	Imágenes de átomos de carbono grafítico de alto orden

Interacción sonda-muestra	Señal de medición	Información
Fuerza	Fuerza electrostática	Forma
Corriente de túnel	Corriente	Forma, conductividad
Fuerza magnética	Fase	Estructura magnética
Fuerza electrostática	Fase	distribución de carga

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-162-4512**			
Escala de enfoque	0,000000			
Rango de enfoque	0,000000			

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización